

报 告 声 明

1. 报告未加盖本实验室业务专用印章无效。
2. 报告无报告人、审核人签名或盖章, 无批准人签名无效。
3. 未经本实验室书面同意不准部分复制报告。
4. 报告仅对委托样品的结论负责。
5. 若对报告有异议, 应于收到报告之日起一个月内向本实验室提出。

相 关 资 质

中国航天科技集团公司元器件可靠性中心九院分中心
航空重点工程电子元器件检验分析站
航空、航天进口半导体器件质量检验分析站
中国人民解放军总装备部军用实验室

通讯地址: 西安市高新路28号西安太乙电子有限公司

邮政编码: 710075

联系电话: 029-88267007, 029-88267155, 029-88267090

传 真: 029-88267006

网 址: www.xataiyi.com

微信公众号: 西安太乙



扫描二维码关注

200720

**** Viewpoint DataLog: Jul 20 2020 ****

Plan Name : OPA2541B.tdl
Device Name: OPA2541BM
Lot # :
Wafer Name :
Operator :
Station No : 1
DUT I/F :
Sub Lot # :
Sample # : 1
Comments :

***** [Test 100] DC PASS "Positive Power Supply Current Test At Vs=+/-40V" *****

Resc :HDC SRng :R64V SVal: 40.00V MRng :M80MA MSeq :
CPVal: 80.00mA CMVal:-80.00mA Slew: 17.58uS Filter:OFF PCCapa: 0.000F
MIM : MIMPCCapa:
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM Dpin DUT Desc
00100 41.31850mA 50.00000mA NONE HDC2 1 +Is

***** [Test 110] DC PASS "Negative Power Supply Current Test At Vs=+/-40V" *****

Resc :HDC SRng :R64V SVal:-40.00V MRng :M80MA MSeq :
CPVal: 80.00mA CMVal:-80.00mA Slew: 17.58uS Filter:OFF PCCapa: 0.000F
MIM : MIMPCCapa:
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM Dpin DUT Desc
00110 -41.20725mA NONE -50.00000mA HDC1 1 -Is

***** [Test 200] JUDGE FAIL "Input Bias Current Ibi+ Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00200 LFAIL -1.345687nA 50.00000pA -50.00000pA 1

***** [Test 210] JUDGE FAIL "Input Bias Current Ibi- Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00210 HFAIL 5.372460nA 50.00000pA -50.00000pA 1

***** [Test 220] JUDGE FAIL "Input Bias Current Ibi2+ Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00220 LFAIL -1.817525nA 50.00000pA -50.00000pA 1

***** [Test 230] JUDGE FAIL "Input Bias Current Ibi2- Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00230 HFAIL 4.905642nA 50.00000pA -50.00000pA 1

***** [Test 300] JUDGE FAIL "Input Offset Current ios1 Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00300 LFAIL -6.718147nA 30.00000pA -30.00000pA 1

***** [Test 310] JUDGE FAIL "Input Offset Current ios2 Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00310 LFAIL -6.723166nA 30.00000pA -30.00000pA 1

***** [Test 400] JUDGE PASS "Input Offset Voltage vos1 Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00400 431.8289uV 1.00000mV -1.00000mV 1

***** [Test 410] JUDGE PASS "Input Offset Voltage vos2 Test At Vs=+/-35V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00410 144.4733uV 1.00000mV -1.00000mV 1

***** [Test 500] JUDGE PASS "Power Supply Rejection Ratio PSRR1 Test At Vs=+/-10V To +/-40V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00500 113.7857dB NONE 100dB 1

***** [Test 510] JUDGE PASS "Power Supply Rejection Ratio PSRR2 Test At Vs=+/-10V To +/-40V" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00510 115.0402dB NONE 100dB 1

***** [Test 600] JUDGE PASS "Common Mode Rejection CMRR1 Ratio Test" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00600 109.4885dB NONE 95dB 1

***** [Test 610] JUDGE PASS "Common Mode Rejection CMRR2 Ratio Test" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00610 109.7488dB NONE 95dB 1

***** [Test 700] JUDGE PASS "Open Loop Gain Avoll Test" *****

Type : DC
TestID RESULT Value UP_LIM LO_LIM DUT
00700 103.4029dB NONE 90dB 1

检测分析报告摘要表

委托单位信息					
委托单位		地址	-----		
联系人	---	联系电话	---	传 真	---
委托日期	20200717	完成日期	20200731	邮 编	---
样品信息					
类 别	电路	生产厂家	BB	生产批次	78S1XE8等
型号规格	OPA2541BM	样品数量	142只	质量等级	----
筛选依据	客户委托单		工程代号	---	
检测方法 依据	GB/T17940-2000《半导体器件集成电路第3部分：模拟集成电路》				
筛选结果	按客户委托单进行常温测试、低温测试、高温测试。 样品总数:142只 合格数:140只,合格率:98.59% 不合格数:2只,不合格率:1.41%				
评价和说明	-----				
报告人	蒋云柏	日 期	20200731		
审核人	汪双超	日 期	20200731		
批准人	樊晓团	日 期	20200731		



检测筛选结果汇总表

序号	试验项目	试验条件	合格数	不合格数	失效模式				
1	常温测试	按相应器件规范	140	2	功能失效、参数超差				
2	低温测试	-25℃	140	0	---				
3	高温测试	+85℃	140	0	---				
总数量	142	合格数	140	合格率	98.59%	不合格数	2	不合格率	1.41%